

DECLARATION UE DE CONFORMITE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

REV12

Page 1/1

22/05/23

LOREME

Aux exigences de protection de la directive CEM (2014/30/UE) "Compatibilité ELECTROMAGNÉTIQUE"
et aux exigences de la directive BT (2014/35/UE) "BASSE TENSION"

With requirements of directive CEM (2014/30/EU) "Electromagnetic Compatibility"

And requirements of directive BT (2014/35/EU) "LOW VOLTAGE"

LOREME déclare sous sa seule responsabilité, que le produit :

We declare under our sole responsibility, that the following product:

Désignation (FR) : **Alimentation variable sur rail DIN**

Designation (US) : **Adjustable Power supply, DIN rail mounting**

Type: **AL175V**

Révision : **0**

date : **08/11/18**



est conforme aux normes génériques ou spécifiques harmonisées suivantes :

Complies with the following harmonized generic or specific standards:

Test Réalisé tested	Normes Standards	Description	Conditions		
Directive basse tension BT (2014/35/UE) <i>Low Voltage Directive BT (2014/35/EU)</i>					
X	NF EN 61010-1 2011	Règle de sécurité pour les appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire	<i>Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use</i>		
EN 61000-6-4/A1 (2011) Compatibilité électromagnétique émission pour les environnements industriels <i>Emission standard for industrial environments</i>			Limites Test level		
X	EN 55011 2016	Emission rayonnée <i>Radiated emission</i>	30-230 MHz: 30 dBµV/m (à 30m) 230-1000 MHz: 37 dBµV/m (à 30m)	Groupe1 Classe A	Ok
X	EN 55011 2016	émission conduite sur l'alimentation <i>power supply induced emission</i>	0.15-0.5 MHz : 79 dBµV / 66 dBµV 0.5-30 MHz : 73 dBµV / 60 dBµV	Groupe1 Classe A	Ok
EN 61000-6-2 (2017) Compatibilité électromagnétique (CEM) Immunité pour les environnements industriels <i>Immunity standard for industrial environments</i>			Niveau de test Test level	Influence Influence	Critère Criteria
X	EN 61000-4-2 ESD 2009	Immunité aux décharges électrostatiques <i>Electrostatic discharge immunity test</i>	4 kV au contact 8 kV dans l'air	Sans influence No influence	B
X	EN 61000-4-3 2006	Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques <i>Radiated Immunity</i>	80 à 1000 MHz 10 V/m (eff) 80% AM (1 kHz)	Sans influence No influence	A
X	EN 61000-4-4 EFT 2013	Immunité aux transitoires électriques rapides en salves <i>Electrical fast transient /burst immunity test</i>	2 kV crête 5 / 50 ns 5 KHz	Sans influence No influence	B
X	EN 61000-4-5 CWG 2014	Immunité aux ondes de chocs 1,2/50 µs. <i>Surge immunity test</i>	1.2/50 (8/20) µs 2 kV	Sans influence No influence	B
X	EN 61000-4-6 2014	Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques <i>Conducted Immunity</i>	0.15 à 80 MHz 10 V 80% AM (1 kHz) 150 Ohms	Sans influence No influence	A
X	EN 61000-4-8 AC MF 2010	Immunité au champ magnétique à la fréquence du réseau <i>Power frequency magnetic field immunity test</i>	50 Hz 30 A/m (RMS)	Sans influence No influence	A
X	EN 61000-4-9 pulse MF 2016	Immunité au champ magnétique impulsionnel <i>Pulse magnetic field immunity test.</i>	1000 A/m peak 6,8/16 µs pulse	Sans influence No influence	B
X	EN 61000-4-11 AC dips 2004	Immunité aux creux de tension, coupures brèves et variations de tension en AC <i>Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests.</i>	-30 % 10 ms -60 % 100 ms -95 % 5000 ms	Sans influence No influence	A -> 10ms B -> 100ms
X	EN 61000-4-12 Ring wave 2007	Immunité aux ondes oscillatoires <i>Oscillatory waves immunity test</i>	2.5 kV common mode 1 kV differential mode @ 1MHz	Sans influence No influence	B
X	EN 61000-4-29 DC dips 2001	Immunité aux creux de tension, coupures brèves et variations de tension en DC <i>Voltage dips, short interruptions and voltage variations on DC input power port immunity tests.</i>	-30 % 10 ms -60 % 100 ms -95 % 5000 ms	Sans influence No influence	A -> 10ms B -> 100ms

Metz, le : **26/11/23**

Signé au nom de LOREME ; M. Nicolas LOUIS.

Signed on behalf of LOREME

Année d'apposition du marquage CE : **2023**

CE marking year